PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-128548

(43)Date of publication of application: 22.05.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/92 H01L 21/288

(21)Application number: 62-286622

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

13.11.1987 (72)Inve

(72)Inventor: SADAKATA TAKAYUKI

BABA HIROYUKI FUJIE NOBUO

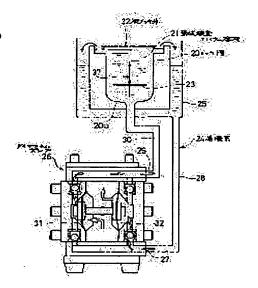
HASEGAWA HITOSHI WADA KUNIHIKO

(54) FINE PATTERN GOLD PLATING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To immediately remove by washing dusts or air bubbles adhered to a surface to be plated by providing an impact to the flow of gold plating solution to apply the impact to a body to be plated.

CONSTITUTION: The flow of solution 12 in a recess 9 is so formed that strong and weak streams are alternately repeated, and an impact force is applied to dusts 17, air bubbles 18 adhered when the weak stream is altered to the strong stream. The dusts 17, the air bubbles 18 are isolated from the surface 7 to be plated by the impact force, forcibly fed and immediately removed out of the recess 9. As a result, the surface 7 to be plated is held in a clean state in which the dusts and the air bubbles 18 are not adhered to remain thereon, and a gold bump 40 of high quality is formed without taking the dusts and air bubbles.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-128548

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)5月22日

H 01 L 21/92 21/288 F-6708-5F E-7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称

微細パターン金メツキ装置

②特 願 昭62-286622

②出 願 昭62(1987)11月13日

⑫発 明 者 定 方

孝 之 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

郊発 明 者 馬 場

広 行

内 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

砂発明者 藤江 信夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発 明 者 長 谷 川 斉

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出願人 富士通株式会社

砂代 理 人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

明相自

1. 発明の名称

微細パターン金メッキ装置

2. 特許請求の範囲

金メッキ液(21)を貯溜し、金メッキが行なわれるメッキ槽(20)と該メッキ槽(20)と

り込れた金メッキ液をポンプにより

該メッキ槽に

再度給送して上記金メッキ液を循環させる循環系
(24)とよりなり、被メッキ体(22)の被メッキ面(7)に徴組パターンの金メッキを行なう

数組パターン金メッキ装置において、

上記ポンプを容積式ポンプ(26)により構成 し、

上記メッキ権(20)内に給送される金メッキ液(21)に衝撃的な圧力が付与されるように構成したことを特徴とする数額パターン金メッキ装置。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

ウェハ上にパンプ等を金メッキにより形成する 微観パターン金メッキ装置に関し、

ゴミ・気返の被メッキ面への付着に対応可能と することを目的とし、

金メッキ被を貯御し、金メッキが行なわれるメッキ権と該メッキ権より溢れた金メッキ液をポンプにより該メッキ権に再度給送して上記金メッキ 依を循環させる循環系とよりなり、被メッキ体の数がメッキ 正式がターンの金メッキ 装置において、上記ポンプにより構成し、上記メッキ権の数 送される金メッキ液に衝撃的な圧力が付与されるように構成する。

(産業上の利用分野)

本発明はウエハ上にパンプ等を金メッキにより 形成する微細パターン金メッキ装置に関する。 近年TAB方式の接続が多く採用されつつある。 このためには、ウェハ上に微報で且つ良質のパン プが形成されている必要がある。

一般にパンプは第6図に示すように金メッキに より形成される。

回図中(A) は金メッキ前の状態であり、後述する被メッキ体22を示す。1はシリコンウェハ、2はアルミニウム製パッド、3はPSG酸、4はパリアメタル、5はフォトレジスト、6は窓である。

窓名に露出しているパリアメタル4の表面が被 メッキ面7である。この被メッキ面7に金が被替 積載して金メッキされる。

フォトレジスト 5 を剥離させると、同図(B)に示すように金パンプ 8 が形成される。金パンプ 7 のサイズは 5 0 μ m \times 100 μ m で厚さが 30 μ m と数額である。

メッキ被としてはフォトレジスト5へのアタックの少ないノンシアン系のもの、例えば亜硫酸金ナトリウムNa』(Au(SO』))。の水溶液を

このマグネットポンプ 1 0 は、ポンプ室 1 1 内 に羽根車 1 2 を設け、外部にモータ 1 3 を設け、 羽根車 1 2 とモータ 1 3 とをマグネット 1 4 . 1 5 により磁気的に連結した構成である。モータ 1 3 により羽根車 1 2 が回転され、メッキ液がポ ンプ室 1 1 より吐出されてメッキ槽に送り込まれる

メッキ権内に送り込まれる金メッキ液の圧力は、 第8図中、線Iで示すように略一定である。

これにより、シリコンウェハ1に作用する金メッキ液の圧力(流れ)も、第9日中矢印16で示すように略一定である。

(発明が解決しようとする問題点)

一方、被メッキ面7の部分は定み9となっており、こゝに第9図に示すように、金メッキ液中に含まれる機構ゴミ17や気泡18が入り込んで付着し易い。

シリコンウェハ1に当たるメッキ液の灰液は一 定であるため、上記度み内のゴミ17、気泡18 使用している。

この種の微報パターンの金メッキでは、被メッキ両7に接触している部分の金メッキ液のイオン 数度が重要である。イオン激度が低下すると、電 圧が増加し、メッキむらを起こし、形成された金 パンプは形状が不揃いとなったり、内部もポーラ スなものとなり易いからである。このような金パ ンプでは、TAB接続の信頼性が低下してしまう。

従って、上記の金メッキを行う装置においては、メッキ権より当れた金メッキ液をポンプによりメッキ権内に再び給送するメッキ液の循環を行なって、被メッキ面に接触する金メッキ液を逐次交換する必要がある。

(従来の技術)

従来の微糊パターン金メッキ装置は、メッキ液を循環させるポンプとしては、ポンプ室内の羽根車をモータによりマグネットを介して回転させるマグネットポンプ循環させるポンプとして、第7 図に示すマグネットポンプ10を使用している。

を確み外に流し去る作用は弱く、ゴミ17、気泡 18が確み9内に残留し易い。

これにより、第6図(B)に示すように、ゴミ 17、気ね18が金パンプ8の内部に取り込まれ、 良質の金パンプを形成することができず、TAB 接続の信頼性も低下してしまうという問題点があった。

本発明は、ゴミ・気泡の被メッキ面への付着に 対応可能である微糖パターン金メッキ装置を提供 することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

 付与されるように構成したものである。 ̄ ̄

(作用)

容積式ポンプは、被メッキ体に作用する金メッ キ被の流れに衝撃力圧力を持たせる。

衝撃的圧力を有する金メッキ被の流れが、被メッキ体に付着したゴミ、気泡を被メッキ体より剝離させて流し去る。

(実施例)

第1 図は本発明の微細パターン金メッキ装置の 一実施例を示す。

図中、20はメッキ権、21はメッキ液である 亜硫酸金ナトリウム溶液である。22は被メッキ 体であり、メッキ権20内に貯溜された溶液21 の液面に接触するように水平に支持されている。 23はアノードである。

2 4 は循環系であり、メッキ槽 2 0 より溢れた 溶液 2 1 を溜める槽 2 5 と、容積式ポンプの一種 であるダイヤフラムポンプ 2 6 と、槽 2 5 とポン

されている前記の被メッキ体22の下面に作用す る。

これにより、被メッキ面7に接触している溶液が逐次交換され、この溶液のイオン濃度の低下が が防止され、金メッキは顛却に進行する。

次に、第3因に示すように、例えばレジスト残留溶解物であるゴミ17、気ね18が窪み9内に 侵入して被メッキ面7に付着した場合の、ゴミ 17、気ね18の建設物作について説明する。

溶液12の窪み9内の流れは、矢印38で示すように強い流れと弱い流れとが交互に繰り返す形となり、弱い流れより強い流れとなるときに付着しているゴミ17。気泡18に衝撃力を作用させる。この衝撃力により、ゴミ17。気泡18が被メッキ面7より制艦され、押し流されて、第4回に示すように、窪み9外に直ちに排除される。

この結果、被メッキ面7はゴミ及び気泡18が付着残留していないクリーンな状態とされ、ゴミ気泡の取り込みの無い、第5図に示す良質の金パンプ40が形成される。

ア26の吸入口27とを連続する配管28と、ポンプ25の吐出口29とメッキ槽20とを連結する配管30とよりなる。

金メッキはポンプ26を駆動させた状態で行なわれる。

ポンプ 2 6 は、左右一対の室が夫々ダイヤフラム3 1 、3 2 により溶液室3 3 、3 4 と空気室3 5 、3 6 とに仕切られ、ダイヤフラム3 1 ・3 2 がセンターロッド3 7 により連結された構造である。圧縮空気を空気室3 5 、3 6 に供給することにより、ダイヤフラム3 1 ・3 2 が連動して動き、溶液室3 3 、3 4 のうちの一方が溶液を吸引し、他方が溶液を吐出する。

溶液は溶液室33、34より交互に吐出され、 ポンプ26より吐出される溶液21の圧力は第2 図中線IIで示す如く短い周期で繰り返し変動する。

配管30はメッキ権20の底面20aの中央に接続してあり、メッキ権20内おいて溶液21は 矢印37で示すように周期的に噴き上げられる。

この存被21の流れが第3回に示すように支持

この金パンプ40に対するTAB接続は高信額性を有する。

上記のダイヤフラムポンプ26の代わりに、ベローズポンプを使用してもよく、同様の効果が得られる。

また、本発明は、上記の金パンプの形成に限らず、例えば金の微幅な記録パターンを形成する場合にも適用できる。

(発明の効果)

以上説明した様に、本発明によれば、金メッキ 被の流れに衝撃を持たせ、被メッキ体に衝撃が付 与される構成であるため、被メッキ面にゴミ又は 気逸が付着したとしてもこれを直ちに洗い流して 除去することが出来る。これにより、ゴミ、気泡 のとり込みのない良質の金メッキによる微細パタ ーンを形成出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の微材パターン金メッキ装置の

一実施例を示す図、

第2図はダイヤフラムポンプによりメッキ権内 へ給送される金メッキ液の圧力を示す図、

第3図は溶液が被メッキ体に作用する様子を示す図、

第4 図はゴミ、気泡が排除される様子を示す図、 第5 図は本発明装置により形成された金パンプ を示す図、

第6図は金メッキによる金パンプの形成を説明 する図、

第7回はマグネットポンプの構造を示す図、

第8図はマグネットポンプによりメッキ槽内へ 給送される金メッキ液の圧力を示す図、

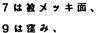
第9 図は金メッキ液がウェハに作用する様子を 示す図である。

図において、

- 1 はシリコンウェハ、
- 2はアルミニウム製パッド、
- 3 はPSG層、

を示す。・

特許出願人 富 士 通 株式会社 代 理 人 弁理士 伊 東 忠



4 はパリアメタル、

5 はフォトレジスト、

17はゴミ、

6は窓、

18は気泡、

20はメッキ槽、

21は亜流酸金ナトリウム溶液、

22は被メッキ体、

23はアノード、

24は循環系、

25は槽、

26はダイヤフラムポンプ、

27は吸入口、

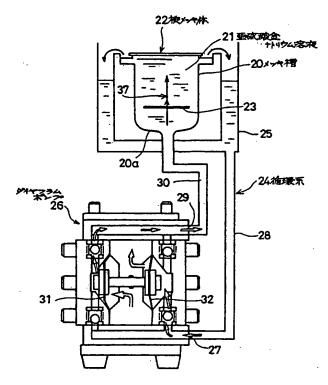
29は吐出口、

31,324447774.

35.36は空気室、

38は被メッキ体に作用する溶液を示す矢印、

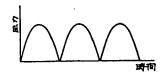
40は良質の金パンプ



本港明の後細ペターン金川・大量の一実施例まれす図

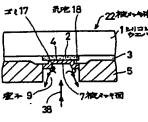
第1図

特開平1-128548 (5)



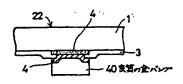
ダイヤフラムポンプによりメッキ指内へ移送 される金メッキ液の圧力を示す図

第 2 図



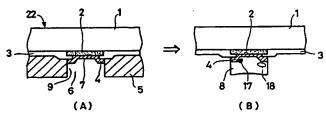
郑疾引被1+4冰に作用する 葆子を示す回

第 3 図



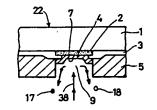
本発明装置(=と)形成された食べいを示す図

第5図



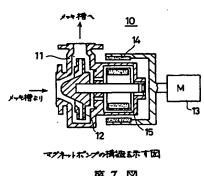
金メッキロよる金パンかの形式を説明する図

第 6 図

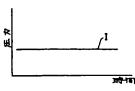


ゴミ気泡が排除される様子を示す図

第 4 図

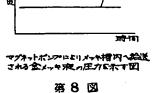


第7図



金沙牛坡ガタンハニ作用する様子を示す図

第9区



第1頁の続き

⑦発 明 者 和 田 邦 彦 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.